X線放射光・短パルスレーザー光の同期特性と超高時間分解測定技術

田中義人(SPring-8/理化学研究所)

【はじめに】放射光源のパルス性を用いた時間分解実験の一つとして、レーザー光をポンプ 光としたポンプ - プローブ実験が挙げられる。その際、短パルスレーザーを放射光パルスに 同期させる技術が必要となる。これまでに SPring-8 においてピコ秒レーザーと硬X線アンジ ュレーター光を同期させて数十ピコ秒の分解能を有する時間分解測定を行ってきた。ここで はまず、SPring-8 での放射光と短パルスレーザーの同期方法とその特性を紹介する。

一方、PF将来計画として検討されている ERL では、100fs オーダーのパルス幅をもつ放射 光が期待されている。ここまで短パルスになると、蓄積リングで行なわれている同期方法が 通用する保証はなく、別の超高時間分解測定法についても検討しておくことが大切である。

【SPring-8 におけるパルスレーザーの同期特性】蓄積リングでの放射光とレーザーを同期させる場合、蓄積リングのRF加速空洞に信号を与えている基準信号に、レーザーを同期させる方法をとるのが一般的である(図 1 参照)。用いたレーザーは、パルス幅 80fs で繰り返しが84.76MHz、すなわち、RF基準信号の1/6の周波数で発振するモードロックチタンサファイアレーザーである。レーザーパルスと基準信号の間のジッター(図 1 中(a))は 50GHz帯域のオシ

ロスコープを用いて評価した結果 2.4ps 以下であることが確認できた。このレ ーザーパルスを再生増幅し、繰り返し 約 1kHz パルスエネルギー約 1mJ のパ ルスを得た。この際、電子バンチの周 回周期も考慮して特定のバンチからの X線パルスに対して同時照射させた[1]。

次に基準信号とリング中の電子バン チのタイミング特性(図1中(b))につい て、RF基準信号により制御されている RF 加速電圧 (RF 加速空洞での印加電





圧)と電子バンチの間の位相が大きくずれる要因は二点考えられる。一つはRF加速電圧の負荷によるピーク電圧降下の影響であり、もう一つはアンジュレーターの放射パワー変化による電子のエネルギー損失変化の影響である。いずれも、電子が一定のエネルギーを維持できるように、RF加速電圧における安定点(位相)が変わるものである。前者、すなわち RF加速電圧の負荷によるピーク電圧降下は、電子バンチが RF加速空洞を通過する際に発生する。蓄積リング中の電子バンチが等間隔で均一に入射されている運転モードでは、その影響は小さかったが、非対称に電子バンチが振り分けられたハイブリッドモードのフィリングに対しては、その効果が無視できない(≈100ps)ことがわかった[2]。しかしながら、この電子バンチのRF加速電圧に対する位相は、電子バンチ毎には安定であり、レーザーパルスは特定のバンチからの放射光パルスだけを狙って当てられているので、電圧降下による位相変化の影響を殆ど受けないことになる。次に後者、すなわち他のビームラインのアンジュレーター放射パワーの影響について調べてみた[1]。その結果、1アンジュレーターあたり約3psの時間のずれが見られた。通常の実験中には、アンジュレーターギャップを全開にすることは少ないので、

深刻な影響はない。しかしながら、将来 SPring-8 に、より多くのアンジュレーターが設置さ れた場合には無視できなくなる可能性があるので、フィードバックをかける方法も検討して いる。

最後にレーザーと放射光パルス間(図1中(c))の同期の様子をストリークカメラでモニター した結果、数時間に渡って±2psの精度で同期していることがわかった。この精度は SPring-8 の放射光パルス幅約40psに対して十分高い精度であり、放射光のパルス幅を生かしたポンプ - プローブ実験を行うことができる。

【超高時間分解測定法の検討】100fs オーダ ーの放射光パルス幅を生かした時間分解測 定法を検討する場合、上記で示した SPring-8 の蓄積リングでの同期精度ではもはや十分 でない。レーザーを外部電気信号にたとえ 100fs 以下の精度で同期できたとしても、ビ ームの安定性を含めて全体として 100fs 以下 の精度となるとそれほど簡単なものではな いことが予想される。

そこで、いっそのこと、パルスごとのジッ ターを抑えることは数ピコ秒の程度であき らめて、単ショットで行う方法を考えてみて はどうか。図2にその配置の一例を描いてみ た。図では結晶表面上の左側と右側で、結晶 の大きさのほぼ2倍の光路差がついている ことになり、X線検出器の位置が遅延時間の



図2:シングルショットでの時間分解測定法

関数となる。レーザー照射による高速の格子膨張過程[3]や圧縮過程[4]、格子振動[5]等を見る 場合には有効であろう。

また、非対称反射そのものでサンプル上へのX線パルスの到達時間を、その位置によって 変えることができる。積算が必要な場合、ショットごとに時間間隔が記録できれば、後で時 間間隔を考慮して積算することができる。図2で示した方法は、X線、レーザー光の時間間 隔を記録する方法としても利用できるものと期待できる。

これらについて予備的な実験を行ったので紹介したい。なお、実験は SPring-8 の原氏(理研)、 村木氏(姫工大)、山崎氏(JASRI)、北村氏(理研)、石川氏(理研)らと行った。

[1] Y.Tanaka et al.: Rev. Sci. Instrum., 71 (2000) 1268-1274; Nucl. Instrum. & Meth. A, 467/468 (2001) 1451-1453.

[2] T.Hara et al.: Nucl. Instrum. & Meth. A, 467/468 (2001) 1125-1126.

[3] V.Tomov et al.: Time-resolved X-ray diffraction, ed. J.R.Helliwell and P.M.Rentzepis (Oxford Univ., New York,

1997) p.1; Y.Tanaka *et al.*: J. Synchrotron Rad. <u>9</u> (2002) 96-98.

[4] Y.Hironaka et al.: Appl. Phys. Lett. 77 (2000) 1967-1969.

[5] A.M.Lindenberg et al.: Phys. Rev. Lett. 84 (1999) 111-114; A.Cavalleri et al.: Phys. Rev. Lett. 85 (2000) 586-589.